
**Surface Chemical Analysis — Atomic
force microscopy — Procedure for in
situ characterization of AFM probe
shank profile used for nanostructure
measurement**

*Analyse chimique des surfaces — Microscopie à balayage de sonde
— Procédure pour la caractérisation in situ des sondes AFM utilisées
pour mesurer la nanostructure*



Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn